

# Angewandte Oberflächenanalyse mit SIMS Sekundär-Ionen- Massenspektrometrie, AES Aufer-Elektronen-Spektrometrie, XPS, Röntgen-Photoelektronen-Spektrometrie



[Angewandte Oberflächenanalyse mit SIMS Sekundär-Ionen- Massenspektrometrie, AES  
Aufer-Elektronen-Spektrometrie, XPS,  
Röntgen-Photoelektronen-Spektrometrie 下载链接1](#)

著者:M. Grasserbauer

出版者:Springer

出版时间:1986-6-13

装帧:Hardcover

isbn:9783540150503

作者介绍:

目录:

[Angewandte Oberflächenanalyse mit SIMS Sekundär-Ionen- Massenspektrometrie, AES  
Aufer-Elektronen-Spektrometrie, XPS,  
Röntgen-Photoelektronen-Spektrometrie 下载链接1](#)

[标签](#)

[评论](#)

---

[Angewandte Oberflächenanalyse mit SIMS Sekundär-Ionen- Massenspektrometrie, AES  
Aufer-Elektronen-Spektrometrie, XPS,  
Röntgen-Photoelektronen-Spektrometrie 下载链接1](#)

[书评](#)

---

[Angewandte Oberflächenanalyse mit SIMS Sekundär-Ionen- Massenspektrometrie, AES  
Aufer-Elektronen-Spektrometrie, XPS,  
Röntgen-Photoelektronen-Spektrometrie 下载链接1](#)